**Nazwa przedmiotu:**

Ochrona własności intelektualnej

**Koordynator przedmiotu:**

-

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Papiernictwo i Poligrafia

**Grupa przedmiotów:**

Nietechniczne HES

**Kod przedmiotu:**

IP-WZW-OWINT-2-09Z

**Semestr nominalny:**

3 / rok ak. 2013/2014

**Liczba punktów ECTS:**

2

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 52 . Obejmuje:
1) Zajęcia kontaktowe z nauczycielem: - obecność na wykładach - 20 godz.; - konsultacje - 2 godz.
RAZEM: 22 godz.
2) Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem (Praca własna studenta):
1. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 20 godz.
2. Przygotowanie się do zaliczenia - 10 godz. RAZEM: 30 godz.

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

1 punkt ECTS.

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

1 punkt ECTS.

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 300h |
| Ćwiczenia:  | 0h |
| Laboratorium:  | 0h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

-

**Limit liczby studentów:**

-

**Cel przedmiotu:**

Celem kształcenia będzie wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej analizy w zakresie zarządzania własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie prostych problemów, jak również przekazanie niezbędnych podstaw teoretycznych w tym zakresie.
Przewiduje się, że w wyniku kształcenia studenci zdobędą umiejętność sprawnego poruszania się w krajowym oraz wybranych zagranicznych systemach ochrony własności intelektualnej.

**Treści kształcenia:**

1h –.Wprowadzenie.
1h – Przedmioty ochrony własności intelektualnej.
4 h - Praktyczne aspekty w zakresie identyfikacji odpowiednich instrumentów ochrony własności intelektualnej.
2 h – Informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych krajowych i międzynarodowych.
2 h – Informacje na temat instytucji występujących w systemie ochrony własności intelektualnej.
2h – Procedura uzyskania praw wyłącznych w Polsce i w Unii Europejskiej.
2 h - Źródła i sposoby pozyskiwania informacji patentowej.
2 h – Konsekwencje powstałe w wyniku naruszenia praw cudzych.
2 h –Wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną.
2 h – Podsumowanie.

**Metody oceny:**

Dwa kolokwia (w formie testów) w trakcie trwania wykładów.

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

1. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej – przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, UPRP, EPO, WIPO, PARP, Warszawa listopad 2003.
2. Umowy jako prawne nrzędzie transferu technologii, Szwec A., Zioło K., Grzesiak M., PARP 2005 – 2006.
3. Prawo autorskie i prawa pokrewne – poradnik przedsiębiorcy, Kuś I., Senda Z., PARP 2004.
4. Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, ORGMASZ Warszawa 2000.
5. Ochrona Własności Przemysłowej – poradnik przedsiębiorcy, Biegański L. PARP 2004.

**Witryna www przedmiotu:**

-

**Uwagi:**

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt OWINT\_W1:**

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

Weryfikacja:

Kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:** PK1A\_W16

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W10

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt OWINT\_U1:**

Na podstawie analizy zalecanej literatury student rozwija swoją wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej

Weryfikacja:

Kolokwium.

**Powiązane efekty kierunkowe:** PK1A\_U05

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt OWINT\_K1:**

Rozumie zagadnienia związane z odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

Przeprowadzenie dyskusji, kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:** PK1A\_K05

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K05